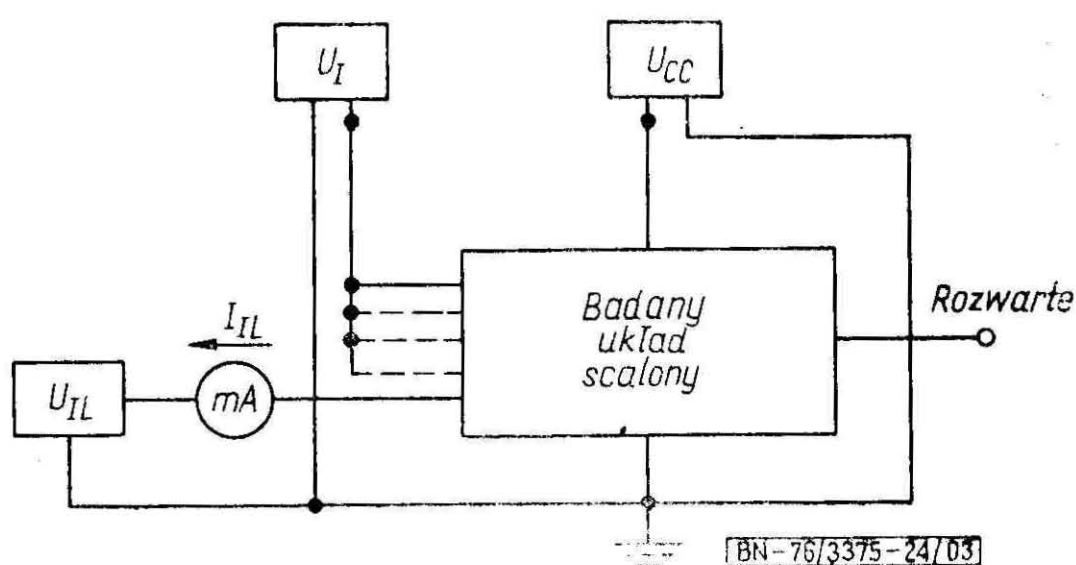


MIKROUKŁADY SCALONE	NORMA BRANŻOWA	BN-76
	Cyfrowe układy scalone Układy kombinatoryjne Metoda pomiaru prądu wejściowego w stanie niskim $I_{IL}$	3375-24 Arkusz 03
		Grupa katalogowa XIX 25

**1. Przedmiot normy.** Przedmiotem normy jest metoda pomiaru prądu wejściowego w stanie niskim  $I_{IL}$  układów kombinatoryjnych monolitycznych o małej skali integracji (SSI).

c) maksymalne zalecane napięcie zasilania,  
d) warunki klimatyczne otoczenia.

**3. Układ pomiarowy** — wg rysunku.



**2. Warunki pomiaru.** Pomiar należy przeprowadzić dla warunków najgorszego przypadku. Norma przedmiotowa powinna zawierać następujące warunki określające dany pomiar:

a) układ pomiarowy,

b) napięcie wejściowe dla warunków najgorszego przypadku (równe wartości maksymalnej wyjściowego napięcia w stanie niskim  $U_{OL\ max}$  dla badanego wejścia; pozostałe wejścia powinny być spolaryzowane napięciem  $U_I$  określonym w normach przedmiotowych; dla układów NIE-LUB-I badane wejście z danego układu  $I$  zasilane napięciem  $U_{OL\ max}$ , pozostałe wejścia tego układu  $I$  — napięciem  $U_I$ , a wejścia pozostałych układów  $I$  powinny być pozostawione otwarte),

**4. Przebieg pomiaru**

a) wstawić układ badany do podstawki pomiarowej,

b) ustawić temperaturę badanego układu zgodnie z wymaganiami normy przedmiotowej (temperatura układu powinna być sprawdzona przed i po pomiarze),

c) ustawić napięcia zasilające zgodnie z normą przedmiotową,

d) ustawić napięcia wejściowe zgodnie z normą przedmiotową,

e) zmierzyć prąd wejściowy  $I_{IL}$ .

W układach zawierających więcej niż jedno wejście, prąd wejściowy  $I_{IL}$  należy mierzyć oddzielnie dla każdego wejścia.

KONIEC

Informacje dodatkowe

Zgłoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników  
Ustanowiona przez Dyrektora Generalnego Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego  
UNITRA dnia 31 stycznia 1976 r.  
jako norma obowiązująca w zakresie czynności określonych normą  
od dnia 1 października 1976 r.  
(Dz. Norm. i Miar nr 9/1976 poz. 30)

**INFORMACJE DODATKOWE**

**1. Instytucja opracowująca normę** — Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników.

**2. Zalecenia międzynarodowe**  
RWPG PC 4506-74 Микросхемы интегральные цифро-

вые. Метод измерения входного тока низкого уровня и высокого уровня — аркуш нормы zgodny.

**3. Autor projektu normy** — mgr inż. Andrzej Zawadzki — Instytut Technologii Elektronowej.